



2023年 9月 15日

各 位

会 社 名 株式会社日本マイクロニクス  
代表者名 代表取締役社長 長谷川正義  
(コード番号 6871 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役上席執行役員管理本部副本部長 片山 ゆき  
(TEL. 0422-21-2665)

## 半導体検査用テスト販売開始のお知らせ

株式会社日本マイクロニクスは、この度、必要なテスト・モジュールを自由に組み合わせ可能なテストを開発し、販売開始したことをお知らせ致します。

### 記

#### 1. 開発・製品化の背景

半導体デバイスの微細化、高集積化が進み、テスト工程とテスト手法が多様化するなか、テストの最適化とコスト低減が求められています。こうしたニーズに応えるため、お客さまごとに専用のテスト環境を構築できるテストを開発致しました。

#### 2. 製品の特長

- (1) 必要なテスト・モジュールを組み合わせ、アプリケーションに応じたテストを構築可能
- (2) テスト・モジュール構成に応じて筐体サイズを3タイプより選択
- (3) ご要望に応じた新たなテスト・モジュールを提供し、幅広いデバイスのテストに対応
- (4) 筐体内に電源や制御PCを内蔵し、省スペース
- (5) テストパターン容量の制限がなく、大規模なデバイスのテストが可能
- (6) テストパターンのロード（転送）時間を大幅に短縮

#### 3. 主な仕様

- (1) 最大動作周波数：100MHz
- (2) 筐体仕様・最大搭載ピン数：

<b>FULL</b>	<b>2,048ch.</b>
<b>HALF</b>	<b>1,024ch.</b>
<b>QUARTER</b>	<b>512ch.</b>
- (3) DPS（デバイスパワーサプライ）：最大 256ch.



#### 4. その他

当該製品は、2023年9月6日～8日に開催された SEMICON Taiwan 2023 で発表致しました。

今後も、「電子計測技術を通して広く社会に貢献する」という経営理念のもと、信頼性の高い半導体検査機器を安定してお届けすることで、社会に貢献して参ります。

製品に関するお問い合わせ先

TE 事業部 営業部

Mail [mjc-tester@mjc.co.jp](mailto:mjc-tester@mjc.co.jp)

TEL 0422-21-0201

以 上